3. 光・フォトニクス 10. スピントロニクス



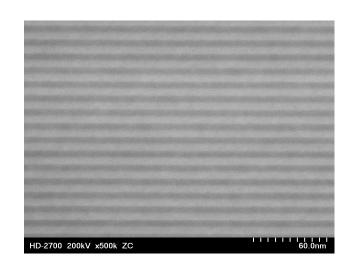
ミクロン/ナノオーダの物理分析、表面分析のツールを多数備えております。 具体的な分析手法が決まっていない場合は、分析目的を教えていただければ、 最適な分析をご提案させていただきます。

形状観察

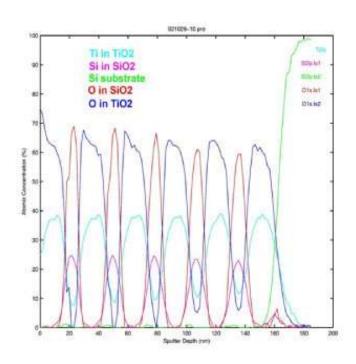
弊社では、TEMやSEM, AFM などを使って、ナノオーダの 形状観察が可能です。

右図は、LEDのMQW構造を STEMで観察した画像(倍率 50万倍)です。

もちろん、観察に必要な加工 も承っております。



組成・深さ評価



組成の定性的/定量的な評価も可能です。

左図は、多層膜の深さ方向の 組成をXPSにて評価した例で す。

その他にも、SIMSや RBS/ERDAなどの装置を利用 することができます。

株式会社 イオンテクノセンター Tel: 072-859-6601 E-mail: info@iontc.co.jp